

AMchip06 – It's here!



Received 7/1/2016

49 chips at INFN Milano

50 chips at LPNHE Paris

50 chips at CERN

Packaging issue is finally solved: the chip is testable/usable

These chips are from a “Slow corner” wafer (half wafer)

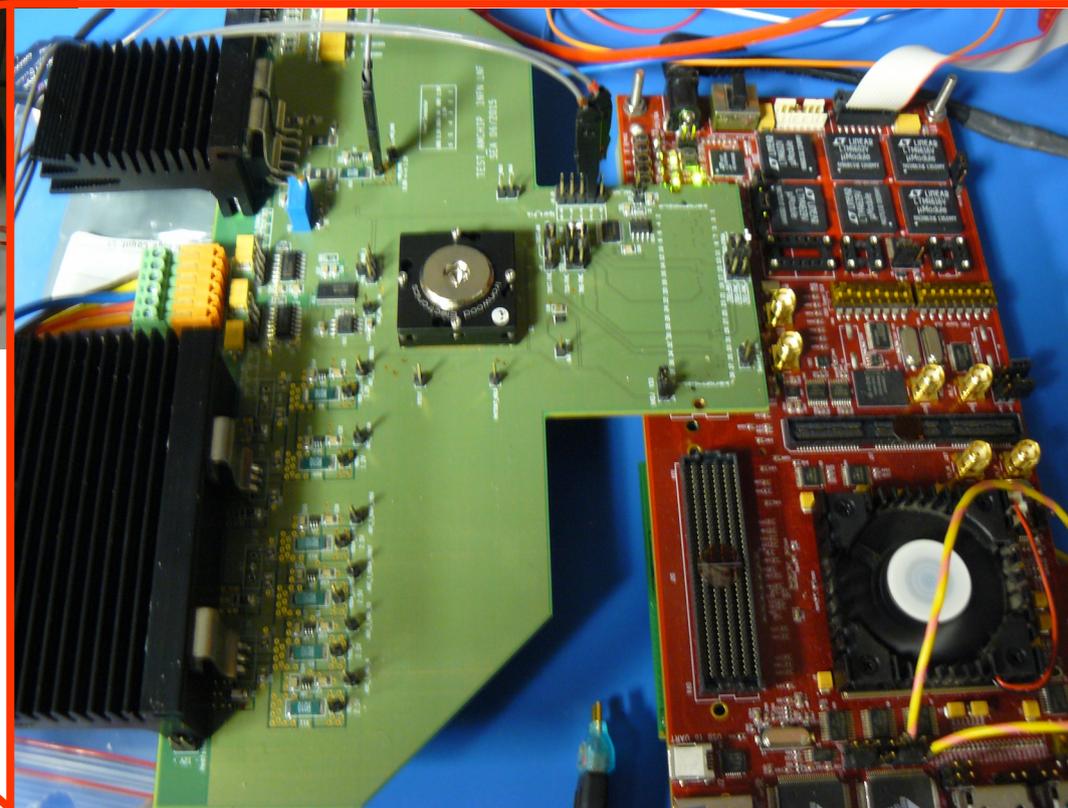
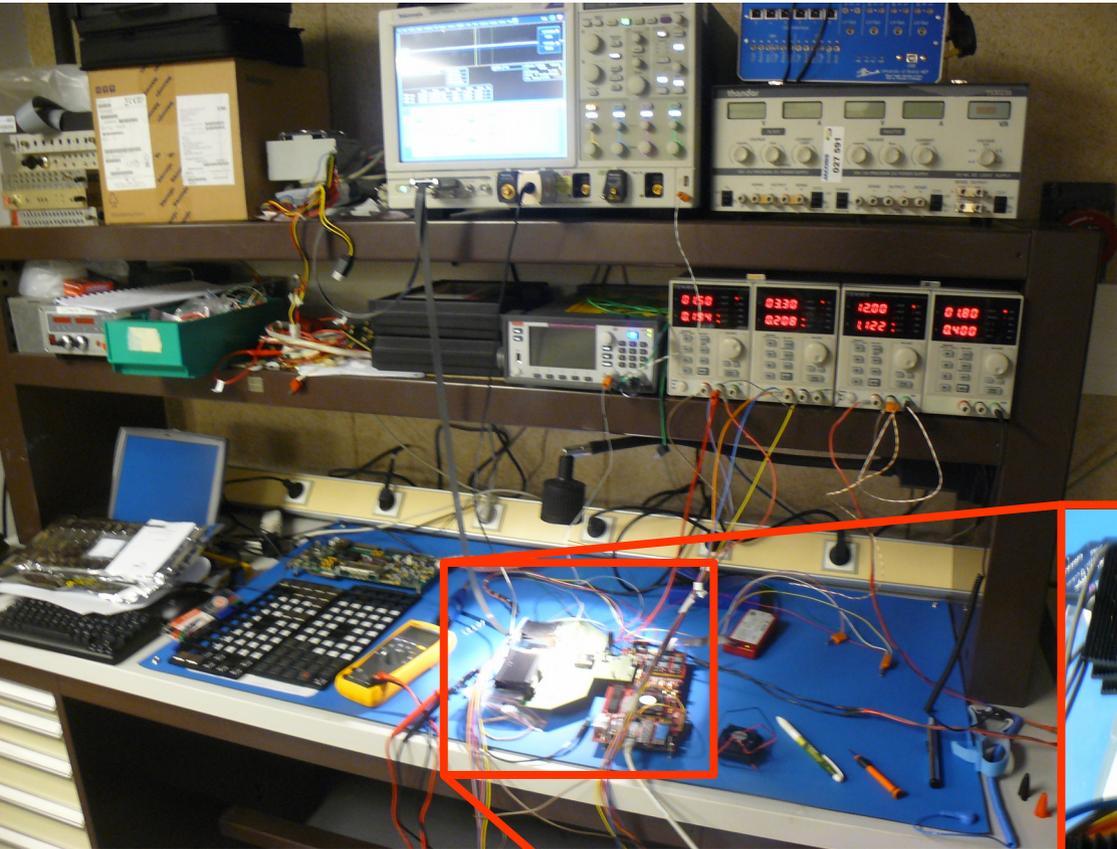
“Typical corner” wafers were packaged the wrong way

We will package soon the remaining “Slow corner” wafers and the “Fast corner” wafers

AMchip06 – First Tests

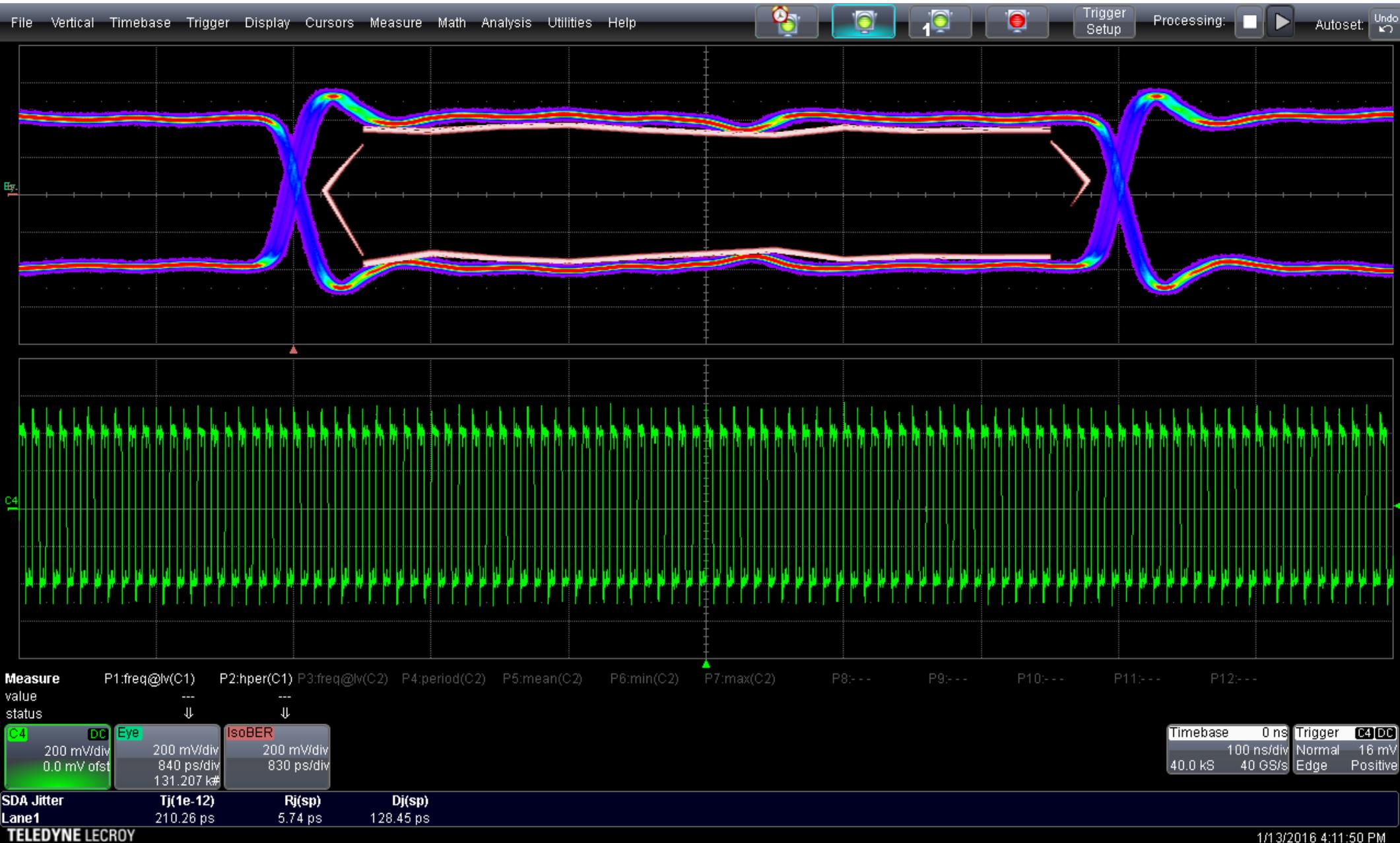
LPNHE Paris (active)
INFN Milano (active)
INFN Frascati (coming soon)

We have exactly the same setup. We are in constant contact to double check results.



Francesco Crescioli, LPNHE Paris

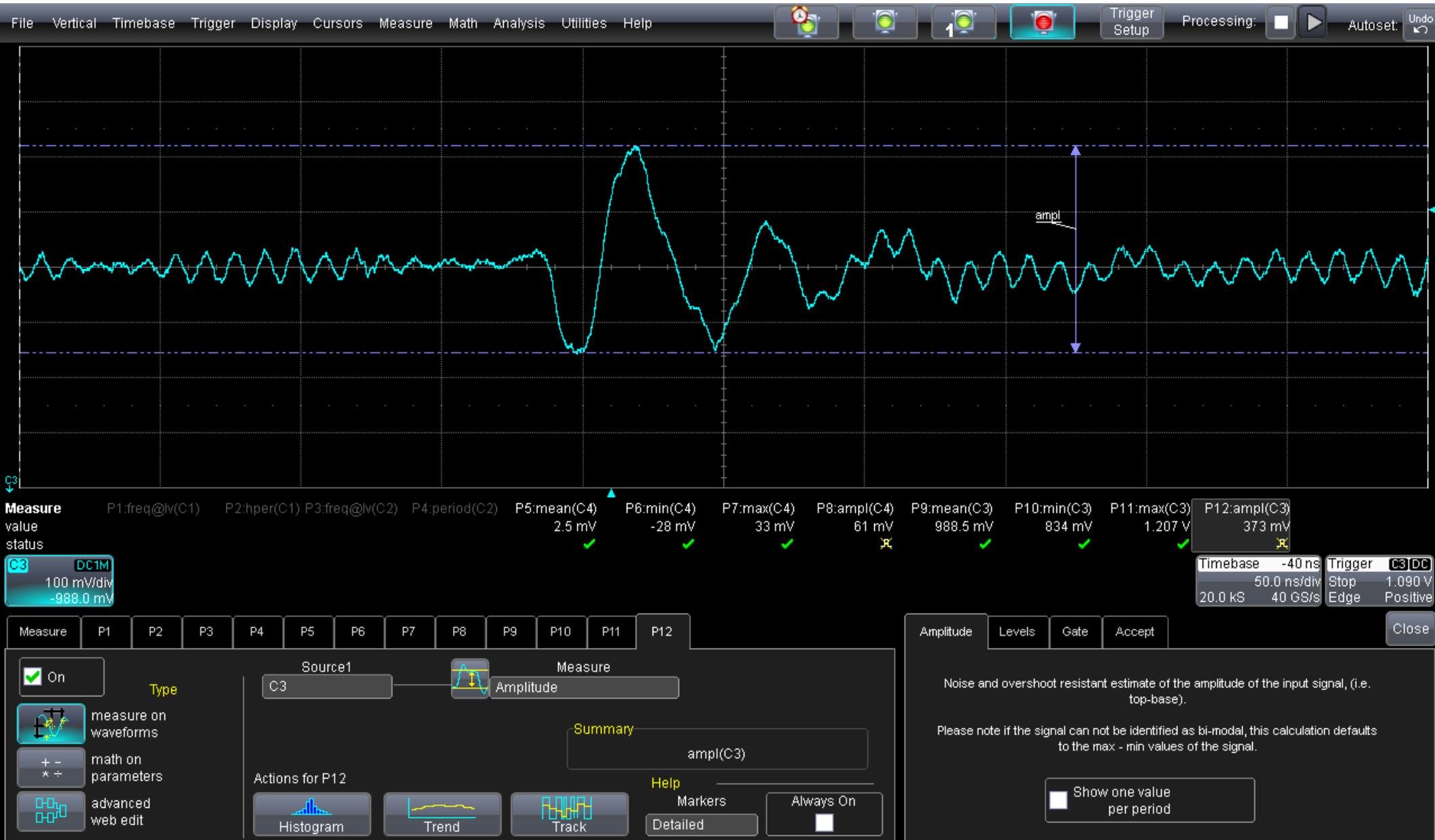
SERDES working (Milano)



Resa dei chip AM core (Parigi)

- I test automatici (con built-in self test) a Parigi hanno mostrato che 42 chip su 50 non hanno difetti nel core (resa = 84%)
- 8 chip su 50 hanno difetti localizzati in qualche banco di memoria
- Nessun chip ha guasti catastrofici

Disturbi sulle alimentazioni



Filtraggio delle alimentazioni

- Stiamo provando a mettere condensatori di filtraggio sotto lo zoccolo del chip per filtrare le alimentazioni
- A Milano abbiamo rimosso tutti i regolatori di tensione per poter misurare il consumo di corrente separatamente su ogni alimentazione